

Céline Crépisson 2 Lames FIB (17 mai)

- 2 échantillons (PC63 et PC66). Capsule de platine avec échantillon à l'intérieur. Chaque capsule est prise dans un plot de résine de 2 cm de diamètre et de 0.5 à 1cm de hauteur
- Échantillons métallisés au carbone
- Composition : (Na,K)AlSi₃O₈, trace de fer, de titane, de xénon, argon, krypton.
- Pas de précaution ou traitement particulier: grille M en cuivre ok
- Lame de 10 micromètres de long.
- Analyse TEM pour connaître la position du xénon dans le minéral.
- Dans la suite du document : images et positions des deux lames FIB (1 et 2) envisagées ainsi que 3 lames FIB « de secours » si il y a un problème (1bis, 2bis, 3bis).

PC63 Xe-Ar



1

100 μm
H

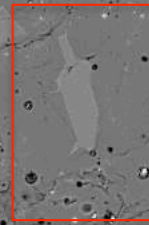
EHT = 15.00 kV
WD = 8.0 mm

Signal A = AsB
Vacuum Mode = High Vacuum

Date :24 Mar 2016
Mag = 26 X

PC63 Xe-Ar

1



20 μ m
└─┘

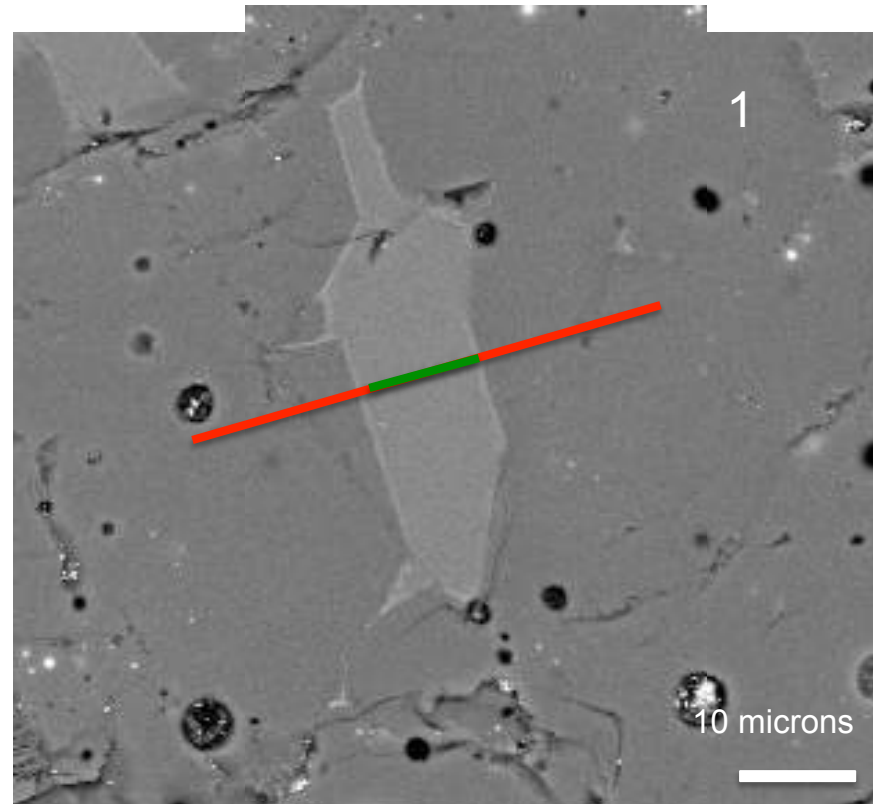
EHT = 15.00 kV
WD = 8.0 mm

Signal A = AsB
Vacuum Mode = High Vacuum

Date : 24 Mar 2016
Mag = 160 X₃

PC63 Xe-Ar

Ligne rouge de 35 microns et ligne verte de 10 microns



PC66 Xe-Kr

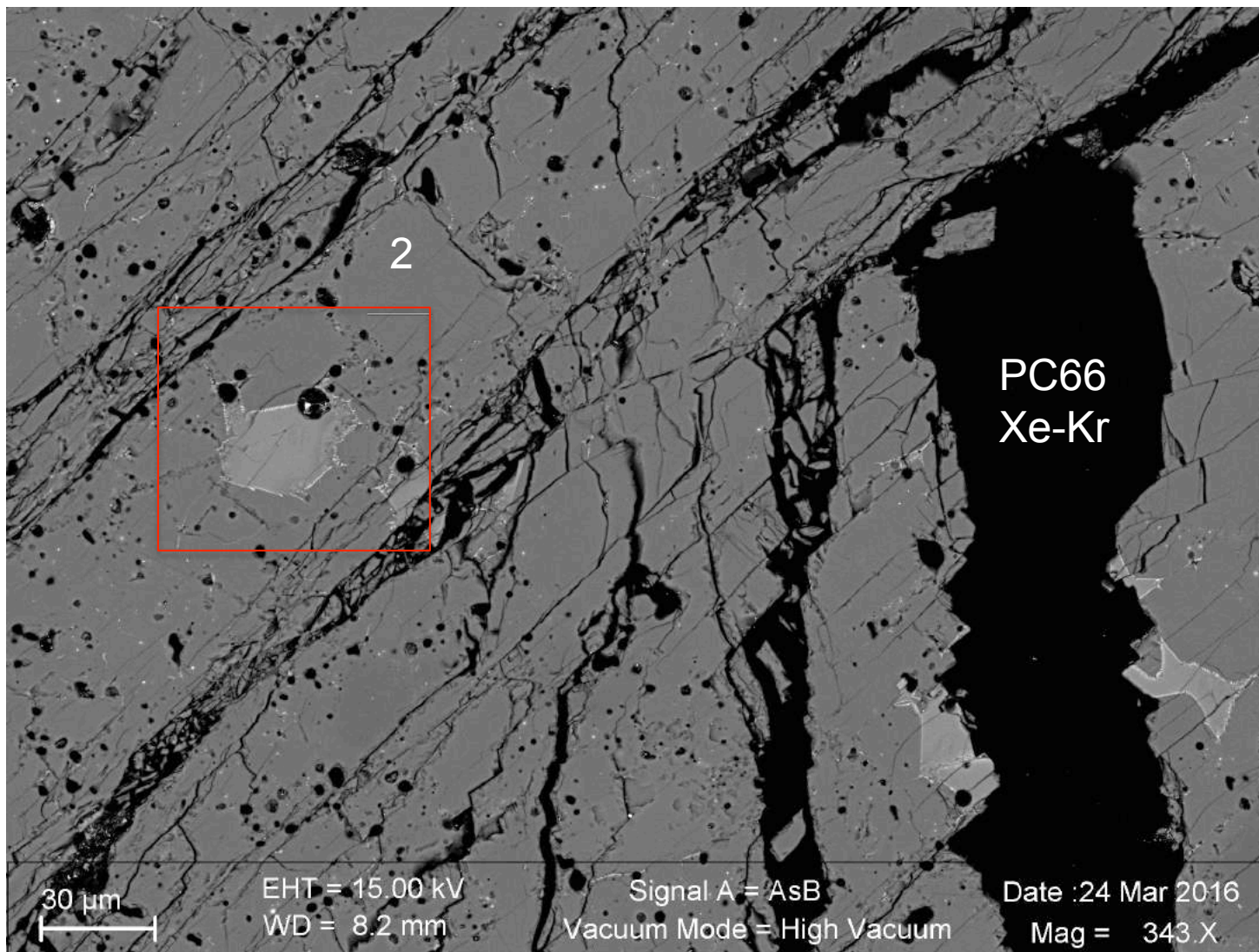
2

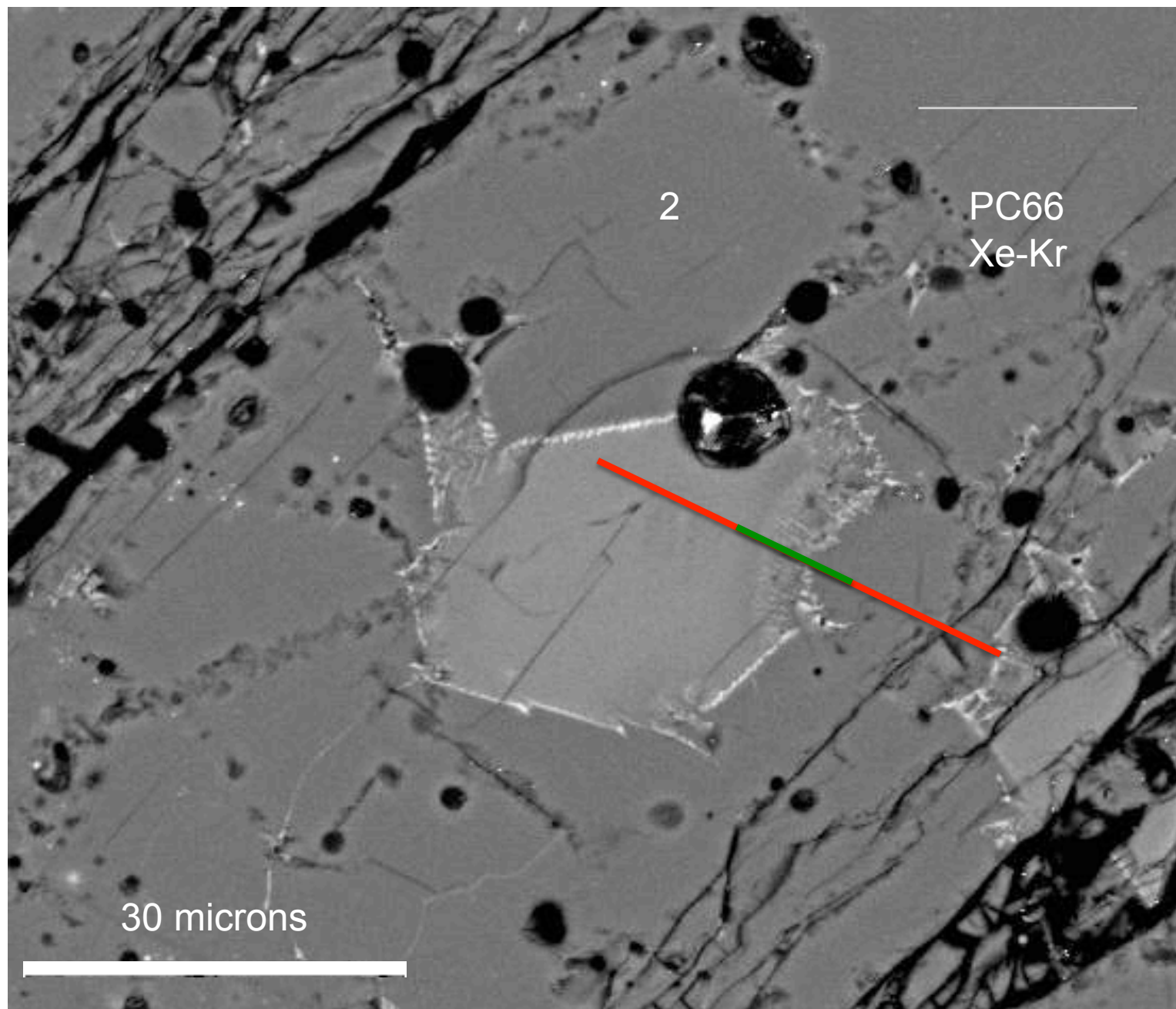
100 μm
H

EHT = 15.00 kV
WD = 8.2 mm

Area A = 1.0 B
Mode = High Vacuum

Date : 24 Mar 2016
Mag = 25⁵ X





Lame de secours en cas de problème

PC63 Xe-Ar

1bis

2bis

100 μm
H

EHT = 15.00 kV
WD = 8.0 mm

Signal A = AsB
Vacuum Mode = High Vacuum

Date :24 Mar 2016
Mag = 26 X

PC63 Xe-Ar

1bis

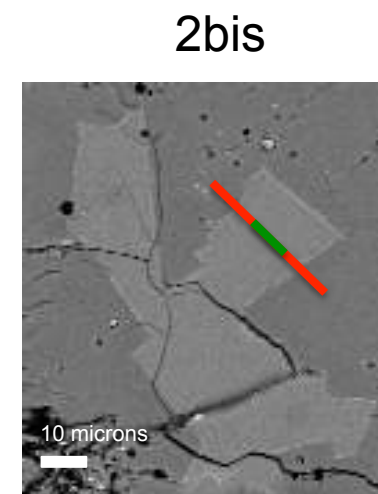
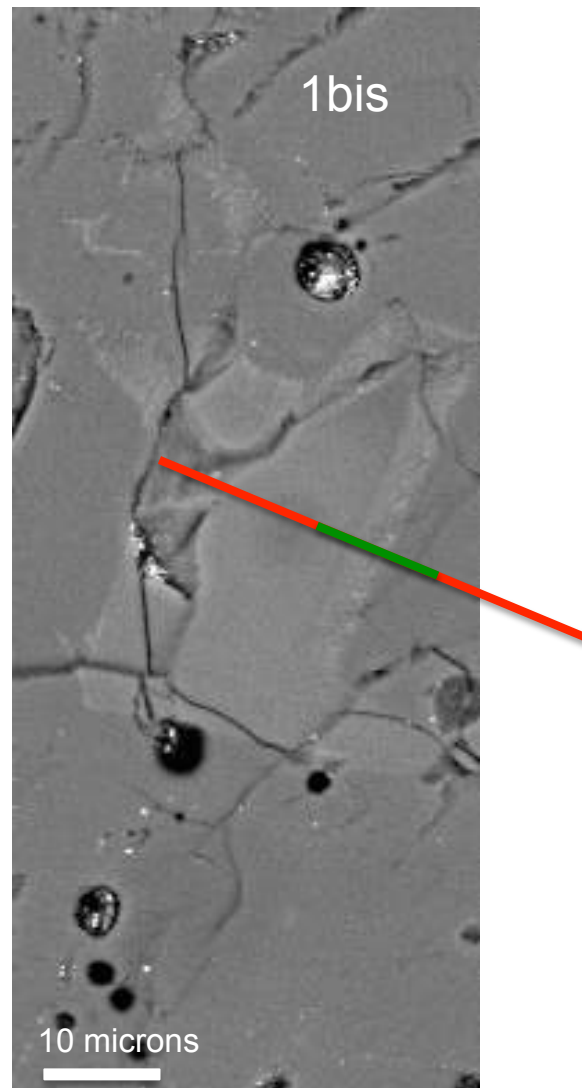
20 μ m
└─┘

EHT = 15.00 kV
WD = 8.0 mm

Signal A = AsB
Vacuum Mode = High Vacuum

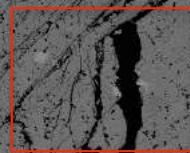
Date : 24 Mar 2016
Mag = 160 X₁₀

PC63 Xe-Ar



PC66 Xe-Kr

3bis

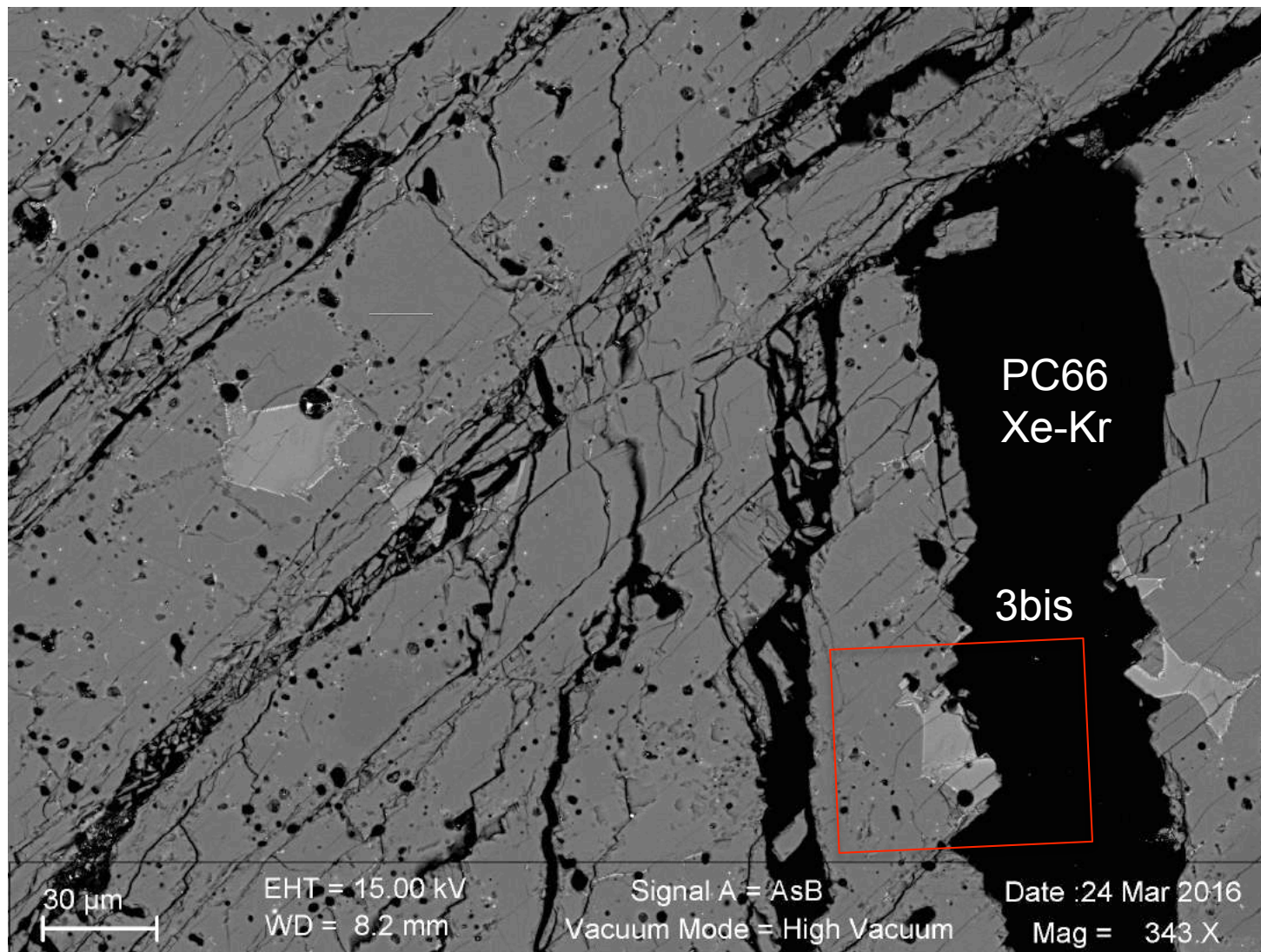


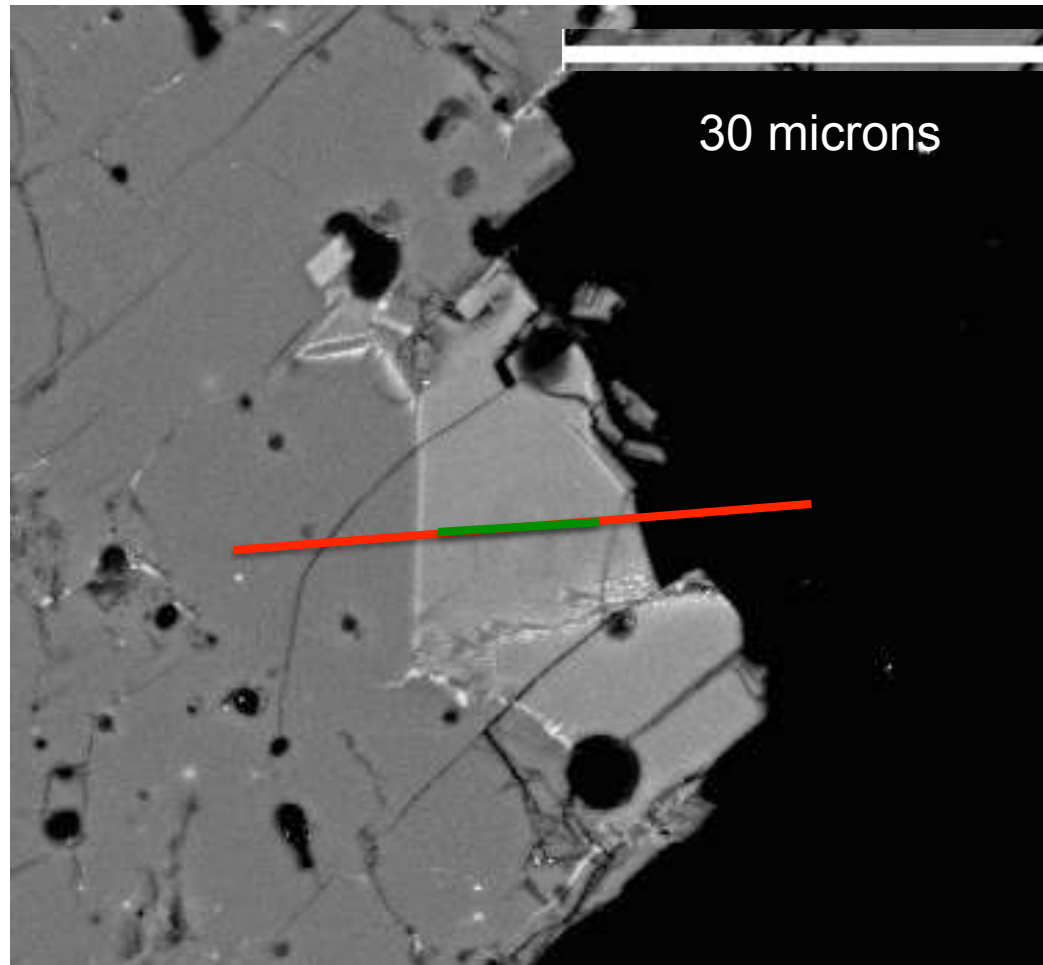
100 μm
H

EHT = 15.00 kV
WD = 8.2 mm

Model A = 1.0 B
Mode = High Vacuum

Date : 24 Mar 2016
Mag = 25 X¹²





3 bis